Search	Notes
a il a t iri es ire aibh	

									_		_		_				-	_	-		-	-		_	-		_	_							
١	ı	I	ľ	ı	ı	İI	۱	II	ı	I	ľ		ı	ı	I	ı	I	I	H	۱	ŀ	ı	1	I	I	11	ı	11	ı	I	1	II	1	Ħ	1
ı	П	ı	l	ı	ı	II	l	II	1	I	ì	ı	ı	ı	li	ı	ı	H	H	П	١	ı	Ш	ı	ł	H	ı	H	l	I	П	Ш	ı	П	ı
ı	Ш	ľ	H	ı	ı	II	ı	II	I	u	I	ı	i	ı	H	ı	ı	I	I	П	ı	I	Ш	ŀ	ł	li	ı	H	I	I	Ц	Ш	1	Ц	ı
ı	Ш	ı	H	ı	ı	1		II	ı	I	Ш	ı	l	ı	II	ı	ı	l	H	П	ı	ı	Ш	ļ	I	ll	ı	ľ	k	I	li	Ш	ı		1
ı	Ш	ı	H	ı	ı	I	ı	II	ľ	II	Ш	ł	ľ	ı	l	ł	ı	H	u	П	ı	H	II	ı	Ш	II	ı		I	H	li	Ш	ı	Ш	ı
ı	н	U	Н	ı	ı	u	L	в	П	Ш	ш	ı	ı	ı	П	ı	ı	Н	H	1	I.	u	п	ı	Ш	11	ı	ш	П	1	Ц	ш	11	u	u

Application No.	Applicant(s)
10/040,963	TEIG ET AL.
Examiner	Art Unit
Vuthe Siek	2825

SEARCHED									
Class	Subclass	Date	Examiner						
716	12-14	4/21/2004	vs						
ame ao	above	9/2/04	V.S						

INTERFERENCE SEARCHED										
Subclass	Date	Examiner								
12-14	9/23/04	US								
	·									
	Subclass	Subclass Date								

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)						
	DATE	EXMR				
EAST all databases & IEEE	4/21/2004	vs				
Sany	9/23/04	VS				